

FIB-SEMセミナー

昨年度に文部科学省事業であるマテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）で導入した複合ビーム加工観察装置（FIB-SEM: JIB-4700F）について、日本電子株式会社様から講師をお招きし、本装置の特徴や新機能紹介をはじめ実際の測定事例についてご講演を頂く運びとなりました。

日 時：2025年7月23日（水） 10：00～

場 所：名古屋工業大学4号館1階110室
※Microsoft Teamsによるオンライン配信あり

参加費：無料



スケジュール

9：30

開場

10：00～10：10「マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）の紹介」

名古屋工業大学大学院工学専攻物理工学類・ARIM事業業務主任者

日原 岳彦 教授

10：10～11：10「FIB-SEMの特徴と主な用途のご紹介」

日本電子株式会社

科学・計測機器営業本部 セミコンダクタ・ソリューションセールス部

河野 一郎 氏

11：10～11：20 休憩・移動

11：20～12：00 JIB-4700F見学会

申込方法

以下のページまたはQRコードよりお申込み下さい。フォームに入力されたメールアドレス宛に参加URLをお送りします。

お申し込みフォーム：<https://kiki.web.nitech.ac.jp/eq-seminar20250723/>

お問合せ

名古屋工業大学 産学官金連携機構 設備共用部門

E-mail：oogata-jim@adm.nitech.ac.jp

URL：https://kiki.web.nitech.ac.jp/

